軟 X 線レーザー照射による誘電体の熱ゆらぎの測定

並 河 一 道

Direct Observation of Polarization Fluctuation in Ferroelectrics by Soft X-Ray Laser

Kazumichi NAMIKAWA

A novel intensity correlation spectroscopy has been discussed. Soft X-ray laser double pulses were prepared by use of a Michelson type delay generator. The first pulse creates excess polarizations in polarization clusters within BaTiO₃ at critical region of phase transition. The second pulse annihilates the residual excess polarizations under relaxation process. The visibility of the incident soft X-ray pulse and the relaxation time of the polarization in polarization clusters were determined by the measurements of the time correlation of speckle intensities there by. A phenomenon of critical slowing down was found at 4.5 K above Tc in the polarization clusters. We propose a scenario of phase transition in BaTiO₃ that the polarization clusters crossover at this temperature from dynamical to static. This technique is applicable widely to such phenomena of phase transition as CDW, SDW and dynamic stripe of high Tc material by use of XFEL or HHG.

Key words: speckle, intensity correlation spectroscopy, relaxation time, plasma X-ray laser, BaTiO₃, critical slowing down

コヒーレントな光を微細な不規則構造をもつ物質に照射 すると、物質から散乱する光には物質の不規則構造を反映 してスペックルとよばれる複雑な干渉像が現れる。物質の 不規則構造に時間的なゆらぎがあれば、この干渉像は変動 し時間的にも複雑なゆらぎを示す¹⁾.スペックル強度相関 分光法は、コヒーレント光源を用いて物質を相次いで照射 し、それぞれの照射に際し物質から散乱される光の強度を 測定し、それらの強度の相関を調べることによって不規則 構造をもつ物質のゆらぎに関する知見を得る手法である。

これまで,スペックル強度相関分光法は,可視光の領域 ではさまざまな物質の計測に利用され,溶液中に分散した 微粒子の粒径や拡散速度の光学的計測法として確立されて いる.しかし,可視光は波長の限界によってナノメートル スケールの物質の微細な構造の解明に適用することはでき なかった.放射光技術の発展によって高輝度放射光源が実 現されるとともに,X線の波長領域でもスペックル強度相 関分光法が試みられ,コロイド粒子の拡散現象,合金の規 則不規則相転移,軟組成物質の不規則構造,磁性体の磁化 過程のドメイン構造などの研究に利用されるようになった.しかしながら,高輝度放射光源といえども,コヒーレントフラックスの割合は0.1%程度しかないので,数マイクロ秒から数秒の間データを蓄積しなければならず,速いタイムスケールの現象に放射光X線のスペックル強度相関分光法を適用することはできなかった.

レーザー励起プラズマを増幅媒質とする過渡励起タイプ の軟X線レーザーは、たかだか0.1 Hz 程度の繰り返しの単 ショット光源ではあるものの、数ピコ秒から1ピコ秒程度 のパルス幅をもち、1パルスに含まれる光子数は放射光を 1秒間積算したときと同程度あり、100%近い空間コヒー レンスをもつ²⁾.プラズマ軟X線レーザーを用いれば、ナ ノメートルの空間スケールでピコ秒のタイムスケールをも つ現象を調べることができる.

誘電体の分極は熱平衡値のまわりに絶えずゆらいでいる が、相転移の臨界領域では相転移の前後に現れる2つの相 のせめぎ合いが激しくなり、このせめぎ合いを反映してさ まざまなタイムスケールの分極のゆらぎが出現することが

東京理科大学総合研究機構(〒278-8510 野田市山崎 2641) E-mail: namikawa@rs.noda.tus.ac.jp

想定される、これらのゆらぎには、個々の分極のゆらぎか ら分極微小領域のゆらぎ, さらには分極微小領域の凝集し たドメインのゆらぎまで、それぞれ異なる時間スケールの ゆらぎが存在する、チタン酸バリウム (BaTiO₃)の場合、 常誘電相と強誘電相との相転移に際し、常誘電相には相転 移温度の100Kも高い温度からサブミクロンの空間スケー ルの局所的な微小分極領域(分極クラスター)の出現する ことが知られている³⁾. 分極クラスターの分極は数十マイ クロ秒の時間スケールで互いに直交する方向に向きを変え ている4). 一方, 分極クラスターの中では, 個々の分極は 熱的な励起や吸収を受け、分極クラスターの分極の大きさ はこれらの励起や吸収の結果平衡値のまわりでゆらいでい る5)、数十マイクロ秒の時間スケールの分極の向きのゆら ぎと分極クラスターの個々の分極のゆらぎとは、空間ス ケールの異なる統計集団に属するものと考えられる。分極 クラスターに過剰な分極が付け加わると、クラスターの分 極は熱的な励起や吸収を受けながら平均値に向かって緩和 していく、この緩和の特性は臨界領域における熱的なゆら ぎの特性を表すものと考えられる。

1. 強度相関分光法の新展開

スペックル強度の時間相関関数 g⁽²⁾(τ) は散乱電場の四次の相関関数で定義され,

 $g^{(2)}(\tau) =$

 $\frac{\langle E^*(\mathbf{k}',\,\omega',\,t)E^*(\mathbf{k}'',\,\omega'',\,t+\tau)E(\mathbf{k}'',\,\omega'',\,t+\tau)E(\mathbf{k}',\,\omega',\,t)\rangle_t}{\langle E^*(\mathbf{k}',\,\omega,\,t)E(\mathbf{k}',\,\omega'',\,t)\rangle_t\langle E^*(\mathbf{k}'',\,\omega'',\,t+\tau)E(\mathbf{k}'',\,\omega'',\,t+\tau)\rangle_t}$ (1)

と表される.ここで、 $E(\mathbf{k}', \omega', t)$ 等は散乱電場を表し、tおよび τ はそれぞれスペックル強度を相次いで測定した試 行の時刻と相次ぐ2回の測定の間の遅延時間を表し、 $\langle \cdots \rangle_t$ は各試行時刻 t で測定された多数の試行に関する平均を 意味し、測定対象の統計平均を表す.以下では、光源の ショットごとの強度の変動を補償するために、強度分布全 体で規格化したスペックル強度を用いて強度相関を考え る.測定対象が異なる時間スケールの統計集団を含む場 合、この統計平均は異なる統計集団ごとの積に分離するこ とができる.

臨界領域にある BaTiO₃に軟 X 線を照射すると,分極ク ラスターによるスペックルが現れる⁶⁾.この現象は,分極 したクラスターが軟 X 線に対し複屈折を呈することによっ て常誘電相の母体と異なる屈折率をもつ微小な散乱体とし て働くことに起因する.しかしながら,数ピコ秒のパルス 幅をもつプラズマ軟 X 線パルスで数十ピコ秒の時間差で観 察したときには,観察時間の範囲で分極クラスターの分極



図1 軟X線二連パルス照射による分極クラスターの分極のゆ らぎの測定法の原理.最初のパルスで分極クラスターに過剰な 分極を付け加え,遅延時間の間に緩和して生き残った過剰な分 極を次のパルスで消滅して,これらに際して散乱されたスペッ クル散乱強度の時間相関をみる.

の向きは変動しない静的なものとみなすことができる。静 的な散乱体にはゆらぎが存在しないので、分極クラスター の数の観察時間に関する相関関数の値は1になる。この場 合、強度相関は分極クラスターの中の個々の分極のゆらぎ に起因するものだけとなる。

軟X線レーザーの二連パルス照射によるスペックルの強 度相関測定の原理⁷⁾を図1に模式的に示す.前の軟X線パ ルスが臨界領域にある BaTiO₃の分極クラスターに照射さ れると1つの分極が生成され,軟X線パルスの持続時間の 間には分極が成長して周辺に広がり,分極クラスターには 過剰な分極が付け加わる.入射軟X線は,成長したこの過 剰な分極によって散乱される.分極クラスターに付け加え られた過剰な分極は熱的吸収を受け,平衡値に向かって緩 和していく.この緩和の途中で後の軟X線パルスが照射さ れると,この時点までに生き残った過剰な分極から分極が 1つ消滅し,パルスの持続時間の間には分極の消滅が周辺 に広がり,生き残りの過剰な分極は消滅する.入射軟X線 は生き残っていたこの過剰な分極による散乱を受ける.

この場合,スペックルの強度相関関数に現れる二連パル スによる散乱電場は,それぞれ,

$$E(\mathbf{k}', \omega', t) = E_0(\mathbf{k}, \omega, t)F(\mathbf{q}, \omega - \omega')$$

$$\exp\{i(\mathbf{k}' \cdot \mathbf{x} - \omega' t)\} \qquad (2)$$

$$E(\mathbf{k}'', \omega'', t + \tau) = E_0'(\mathbf{k}, \omega, t + \tau)F'(\mathbf{q}', \omega - \omega'')$$

$$\exp\{i[\mathbf{k}'' \cdot \mathbf{x} - \omega''(t + \tau)]\} \qquad (3)$$

と表される.ここで、 $E_0(\mathbf{k}, \boldsymbol{\omega}, t)$ および $E_0'(\mathbf{k}, \boldsymbol{\omega}, t+\tau)$ は それぞれ前のパルスおよび後のパルスの入射電場を表し、 $F(\mathbf{q}, \boldsymbol{\omega}-\boldsymbol{\omega}')$ および $F'(\mathbf{q}', \boldsymbol{\omega}-\boldsymbol{\omega}'')$ はそれぞれ前のパルスお よび後のパルスの試料によるスペックルの散乱振幅を表 し、それぞれ、

$$F(\boldsymbol{q}, \omega - \omega') = \langle \boldsymbol{k}', \omega' | \langle \varphi' | H_{\text{eff}} | \varphi \rangle | \boldsymbol{k}, \omega \rangle \qquad (4)$$

 $F'(q', \omega - \omega'') = \langle \mathbf{k}'', \omega'' | \langle \varphi | H'_{\text{eff}} | \varphi'' \rangle | \mathbf{k}, \omega \rangle$ (5) と表される.ここで、 $|\mathbf{k}, \omega \rangle$ は入射軟 X 線の状態を表し、 $\langle \mathbf{k}', \omega' |$ および $\langle \mathbf{k}'', \omega'' |$ は前のパルスおよび後のパルスの 散乱後の軟 X 線の状態を表す.また、 $|\varphi \rangle$ および $\langle \varphi' |$ は前

40巻5号(2011)



図2 プラズマ軟X線パルスレーザーを光源とする強度相関 測定装置.マイケルソン型の遅延時間発生器で二連パルスを 生成し,X線ストリークカメラを用いて二連パルスによるス ペックル散乱強度を分離・記録する.

のパルスの照射前後の分極クラスターの状態を表す.一 方, |φ">および ⟨φ| は後のパルスの照射前後の分極クラス ターの状態を表す.軟X線パルスと分極の相互作用を表す *H*eff は,入射軟 X線光子を消滅して分極クラスターにナノ メートルスケールの分極を付け加え,散乱軟 X線光子を生 成する有効ハミルトニアンで,*H*'eff は入射軟 X線光子を消 減し分極クラスターからナノメートルスケールの分極を引 き去り散乱軟 X線光子を生成する有効ハミルトニアンであ る.前のパルスでストークス散乱のように励起された分極 クラスターの状態は,後のパルスでアンチストークス散乱 のように脱励起され,もとの状態に戻ることになる.

散乱強度の相関関数には、当然、入射電場 $E_0(\mathbf{k}, \boldsymbol{\omega}, t)$ お よび $E_0'(\mathbf{k}, \boldsymbol{\omega}, t+\tau)$ の熱的光源としての相関が現れるが、 いまの場合、入射電場 $E_0(\mathbf{k}, \boldsymbol{\omega}, t)$ と $E_0'(\mathbf{k}, \boldsymbol{\omega}, t+\tau)$ は同じ 軟 X線パルスをビームスプリッターで2つのパルスに分け た電場であるから、同時刻における入射軟 X線強度のゆら ぎの観察時間に関する相関が現れ、これは可視度の2乗で 表される.可視度の2乗で表されるパラメーターを β とす れば、 β は入射軟 X線のコヒーレンスに依存し、一次コ ヒーレントな熱的光源については β は1になる.一方、分 極クラスターの分極の数の分布がプランクの分布則(熱分 布則)にしたがうものとすれば、二連パルスによるスペッ クル強度の二次の相関関数は一次の相関関数によって、

 $g^{(2)}(\boldsymbol{q}, \tau) = 1 + \beta |g^{(1)}(\boldsymbol{q}, \tau)|^2 \qquad (6)$

と表される.ここで、散乱ベクトル*q*と*q*′の差,および 散乱前後の光子のエネルギーωとω′およびω″の差は実験 では分解できないので、これらの差は無視して表記してい る.さらに、この場合、一次の相関関数は単一の指数関数 で表されるので、分極の数のゆらぎのコヒーレント時間を τ₀とすれば,

$$g^{(2)}(\boldsymbol{q},\tau) = 1 + \beta \exp\left(-\frac{2\tau}{\tau_0}\right) \tag{7}$$

と表せる.それゆえ、二連パルスで照射して、スペックル 散乱強度を測定し強度の時間相関を求めれば、入射軟X線 の可視度と同時に分極のゆらぎの緩和時間 τ_0 を決めるこ とができる.

2. 実 験

実験装置⁸⁾は、図2に概略を示すように、ダブルター ゲット方式の軟 X 線光源, 集光ミラー, ビームスプリッ ター,マイケルソン型の遅延生成器,調整用 CCD カメ ラ、試料ホルダー、および時間分解記録用ストリークカメ ラなどから構成されている。光源には、過渡励起電子衝突 型 Ni 様 Ag プラズマ軟 X 線パルスレーザーを利用してい る. この軟 X 線パルスレーザーの波長は 13.9 nm で, 10⁻⁴ 程度のエネルギー広がりをもち,発散角は 0.5 mrad 程度 で、およそ7psのパルス幅をもつ、1パルスに含まれる軟 X線光子数は10¹⁰程度あり、コヒーレントフラックスは 80%以上もある。ダブルターゲット方式の軟X線レーザー の発光源のサイズは 60 µm 程度で、これを発光源から 3000 mm 離れた位置に置いた球面鏡を用いて、ほぼ1:1 で試料上に投影している。試料はフラックス法で成長させ たいわゆるバタフライタイプの BaTiO3 単結晶で、相転移 温度 395 K をもつ。 試料温度は室温 296~430 K の範囲ま で 0.1 K で温度制御ができるようになっている。 試料ス テージは X-Y-Z-θ 方向に可動で、 試料に対する入射ビーム の視射角を変えてスペックルが観察できるようになってい る、試料表面の集光状態確認のため、反射光の様子を真空 封止型の CCD で追尾して観察できるようになっている. 実験は入射ビームの視射角を 10° に設定して行った. 垂直 方向のビームの集光サイズは半値幅で60 µm 程度である。 集光光路の途中に置いたビームスプリッターで入射ビーム を2つに分け、2つの直入射鏡を用いてマイケルソン型の 干渉計を組み、それぞれの光路の長さを調整して遅延時間 を付けて軟X線二連パルスの生成を行っている。これらの 二連パルスによるスペックルは、試料の下流 650 mm に設 置した、CsI をカソードとする軟 X 線ストリークカメラを 用いて時間分解して記録している. 軟X線ストリークカメ ラの入射スリットの幅は 100 μm で,スリットの長さは水 平方向に 11 mm である.

試料温度を 395 K に設定し遅延時間を 25 ps としたとき, 軟X線ストリークカメラで記録したX線スペックル像を図3(a)に例示してある.この図の2本のストリーク像



図3 ストリークカメラで観察した散乱面内の強度分布を表す(a)スペックル像と, (b) その強度プロファイル(散乱ベクトル q の原点は鏡面反射の位置にとってある).

は水平面内のスペックル強度分布を表し、図の縦方向に時 間分解されており、上から順に前のパルスによるスペック ル像および後のパルスによるスペックル像である。強度分 布の中心が鏡面反射の位置を表し、右側が高散乱角側であ る。図3(b)は、鏡面反射の位置を q=0 として水平面内 の散乱ベクトルの大きさ q について表した、二連パルスに よるスペックル強度分布のプロファイルである。スペック ル強度の変動の間隔はスペックルのサイズ λz/D に対応し ている.ここで、z は試料と CCD の距離を表し、D は試料 に入射する軟 X 線の集光サイズを表す.

これらのプロファイルの同じgに対応する規格化した強 度の間で積 $I(t)I(t+\tau)$ を求め、測定時刻tを変えて同様な 測定を繰り返し、統計平均を求める.図4はこのようにし て求めた強度相関関数 $g^{(2)}(q, \tau)$ の例で,鏡面反射を含む q=±0.24 μm⁻¹の範囲を示してある. 鏡面反射のすそ野 ではスペックル強度は弱く, $g^{(2)}(q, \tau)$ の値は1のまわりで 大きくばらつくので、鏡面反射の外側は議論しない。 強度 相関関数の値は、鏡面反射の中心の q=±0.08 µm⁻¹の範 囲で大きく、この外側では1となる.鏡面反射の中心部分 の散乱強度は入射軟X線パルスで照射された領域にある任 意の分極クラスターからの寄与を意味するので、散乱角の この範囲の強度相関は軟X線パルス照射によって生成され た過剰な分極の緩和に関するダイナミックスを具現してい る.図4は値が多少変動しているので、適当な範囲で平 均をとって強度相関関数を決める必要がある。散乱角 q= ±0.08 µm⁻¹の範囲の大きさは入射ビームの発散角を考慮 したときのスペックルサイズの程度であり、スペックルサ イズの範囲がコヒーレントな領域である。不規則に分布す る散乱体からの散乱光をスペックルサイズよりも広い範囲



図4 スペックル像の強度プロファイルから求めた鏡面反射 の中心付近の強度相関関数 $g^{(2)}(q, \tau)$. 鏡面反射を中心とする $q=\pm 0.08 \,\mu m^{-1}$ の範囲はスペックルサイズに対応する. この 範囲で平均をとって $g^{(2)}(0, \tau)$ の値とする.

で重ね合わせると、散乱光はコヒーレンスを消失する.強度相関関数の平均を求めるために一次コヒーレントなスペックルサイズを超えて強度相関関数の値を積算すると、一次コヒーレントでない散乱光は二次コヒーレントでないため、強度相関は意味を失う.鏡面反射の中心部分 $q = \pm 0.08 \ \mu m^{-1}$ の範囲で積算し平均値を求め、鏡面反射に対する強度相関関数 $g^{(2)}(0, \tau)$ の値とした.

3. 測定結果と議論

遅延時間を変えて強度相関関数 $g^{(2)}(0, \tau)$ を求め,式 (7) でフィッティングしたものが図 5 に試料温度をパラ メーターとして示してある.図5(a) と(b) はそれぞれ 独立な測定によるもので,(a) は 393 Kから 405 Kまで 2 K間隔で測定したもの,(b) は 401 Kから 405 Kまで 0.5 K間隔で測定したものであり,(a) と(b) の同じ温度 399 Kで測定したデータは再現性の程度を表している.これら



図5 遅延時間に対する強度相関関数 $g^{(2)}(0, \tau)$ の変化。単一の 指数関数でフィットして可視度 β と緩和時間 τ_0 の値を求めた。 可視度 β の値は試料の温度によらず 0.6 程度の値になる。図の (a) と (b)のデータはそれぞれ独立な実験によって得られた。

のデータはいずれも単一の指数関数でよくフィットでき $\tau = 0$ における β の値はすべての温度についてほぼ0.6 付近 の値を示している.この値は入射軟X線レーザーの可視度 が 80%程度あることを意味し、この実験の場合、軟X線 レーザーの発散角が 0.5 mrad 程度であることを考慮する と、発散角が 0.2 mrad の場合にヤングのダブルスリット を用いて測った実験結果と比べて妥当な値といえる.この 結果は測定の信頼性と解析の妥当性を表しているもので ある.

図5のデータからフィッティングで緩和時間 τ_0 を求め て、 τ_0 の温度依存性をプロットして図6に示した.分極ク ラスターの分極の大きさの温度依存性も同じ図に示してあ る.図に示した温度範囲は相転移の臨界領域に相当し、試 料の温度が高温側から T_c に向かって低下すると、緩和時 間は十数ピコ秒から数十ピコ秒の範囲で大きく変動する が、転移温度 T_c の5Kほど高温側で急激に長くなり、分極 が最大になる温度で最も長くなり、緩和時間の最大値は 90ピコ秒程度になる.

これらの振る舞いは、分極クラスターには、相転移温度 のおよそ 4.5 K 高温側で分極のゆらぎが大きくなり遅くな る現象、つまり、臨界緩和の現象が起きていることを意味 している.この温度付近で緩和時間が発散的に長くなり、 分極クラスターが動的な存在から静的な存在に転化するこ



図6 緩和時間 τ_0 および分極の温度依存性. 試料温度が下がると, T_c のおよそ4.5 K 高温側で緩和時間は突然遅くなり最大値をとり, 分極の大きさもほぼ同じ温度で最大値をとる. これらの事実は, この温度で分極クラスターに臨界緩和の現象が起きていることを意味する.



図7 分極クラスター間距離dおよびクラスターサイズ σ_s の 温度依存性.分極クラスターのクラスター間距離は温度の低 下に比例して短くなるが、クラスターサイズはあまり変化し ない.これらのデータの近似直線(図の点線)は転移温度の 6K低温側で交わる.

とを示唆している。この場合、ゆらぎの緩和時間がいった ん最大になった後また短くなっていることは、分極が静的 な存在になったためであると解釈できる。静的な分極クラ スターでは分極のゆらぎは小さく、緩和が速くなるからで ある、分極クラスターのサイズ、クラスター間距離の温度 依存性は図7のように変化し、クラスターサイズがほとん ど変化しないのに対し、クラスター間距離は温度に比例し て短くなる⁶⁾.図7の直線を低温側に延長すると、これら の直線は転移温度の6K低温側で交差し、このことは試料 がこの温度に達すると試料全体が分極クラスターで埋め尽 くされることを意味する.これらの実験結果から,転移温 度の100K程度から出現した分極クラスターは、相転移温 度に近づくにしたがいその数を増し、相転移温度のおよそ 4.5 K 高温側で臨界緩和を示し、動的な存在から静的な存 在に転化して、相転移温度で分極クラスターの分極の向き がそろって巨視的な分極領域が発生するという相転移のシ

ナリオが描ける.これらの巨視的な分極領域は相転移温度の6K低温側においてすべて埋め尽くされ,古典的な分極 ドメインが完結する.

この研究では、分極クラスターを構成している個々の分 極の緩和時間の臨界領域における振る舞いを観察すること によって、なぜ分極クラスターの分極の大きさは相転移温 度より4.5K高温側で最大になるのかという疑問や、BaTiO3 の相転移にまつわる変位型相転移と秩序無秩序型相転移の クロスオーバー / 共存の問題 9-11) に対し、分極クラスター の動的挙動に基礎をおいた新しい観点からひとつの回答を 与えることができた、組成相境界など誘電体の相転移の臨 界領域は複数の安定相がせめぎ合う不安定領域であり、こ の領域における分極の動的挙動には、空間スケールと時間 スケールのそれぞれに依存して安定領域には現れない物性 が姿を見せるものと考えられる。そのような偶然姿を見せ る過渡的領域の物性は、異なる環境のもとでは安定な相の 物性として出現する可能性を秘めている。レーザー励起に よるスペックル強度相関分光法は、X線自由電子レーザー (XFEL) や高調波 X 線などの短いパルス幅のコヒーレント パルスX線光源の発展によって、電荷密度波(CDW)や スピン密度波 (SDW), さらには高温超伝導体の動的スト ライプなど広く物性の研究に展開されるものと考えられ る、レーザー励起によるスペックル強度相関分光法は、相 転移の臨界領域において新しい物質の可能性を探る探索の 窓である.

この研究は、JST の CREST 研究領域「物質現象の解明 と応用に資する新しい計測・分析基盤技術」(研究総括田 中通義)のもと、研究課題「高いコヒーレンスをもつ軟 X 線レーザーを利用した新固体分光法の構築」(研究代表者 並河一道)として、共同研究者岸本牧(日本原子力研究開 発機構)、那須奎一郎(高エネルギー加速器研究機構)、松 下栄子(岐阜大学), R. Z. Tai(上海応用物理研究所)とと もに,日本原子力研究開発機構関西光科学研究所で行った 研究である.付記して,感謝する.

文 献

- 1) J. W. Goodman: *Speckle Phenomena in Optics* (Roberts and Company Publishers, Colorado, 2006).
- 2) M. Nishikino, M. Tanaka, K. Nagashima, M. Kishimoto, M. Kado, T. Kawachi, K. Sukegawa, Y. Ochi, N. Hasegawa and Y. Kato: "Demonstration of a soft-x-ray laser at 13.9 nm with full spatial coherence," Phys. Rev. A, 68 (2003) 061802 (R).
- G. Burns and F. H. Dacol: "Polarization in the cubic phase of BaTIO₃," Solid State Commun., 42 (1982) 9–12.
- B. Zalar, A. Lebar, J. Seliger, R. Blinc, V. V. Laguta and M. Itoh: "NMR study of disorder in BaTiO₃ and SrTiO₃," Phys. Rev. B, **71** (2005) 064107.
- M. Maglione, R. Böhmer, A. Loidl and U. T. Höchli: "Polar relaxation mode in pure and iron-doped barium titanate," Phys. Rev. B, 40 (1989) 11441–11444.
- 6) R. Z. Tai, K. Namikawa, A. Sawada, M. Kishimoto, M. Tanaka, P. Lu, K. Nagashima, H. Maruyama and M. Ando: "Picosecond view of microscopic-scale polarization clusters in paraelectric BaTiO₃," Phys. Rev. Lett., **93** (2004) 087601.
- 7) K. Namikawa, M. Kishimoto, K. Nasu, E. Matsushita, R. Z. Tai, K. Sukegawa, H. Yamatani, H. Hasegawa, M. Nishikino, M. Tanaka and K. Nagashima: "Direct observation of the critical relaxation of polarization clusters in BaTiO₃ using a pulsed Xray laser technique," Phys. Rev. Lett. **103** (2009) 197401.
- 8) M. Kishimoto, K. Namikawa, K. Sukegawa, H. Yamatani, N. Hasegawa and M. Tanaka: "Intensity correlation measurement system by picosecond single shot soft x-ray laser," Rev. Sci. Instrum., 81 (2010) 013905.
- M. Stachiotti, A. Dobry R. Migoni and A. Bussmann-Holder: "Crossover from a displacive to an order-disorder transition in the nonlinear-polarizability model," Phys. Rev. B, 47 (1993) 2473–2479.
- B. Zalar, V. V. Laguta and R. Blinc: "NMR evidence for the coexistence of order-disorder and displacive components in barium titanate," Phys. Rev. Lett., 90 (2003) 037601.
- K. Ji, K. Namikawa, H. Zheng and K. Nasu: "Quantum Monte Carlo study on speckle variation due to photorelaxation of ferroelectric clusters in paraelectric barium titanate," Phys. Rev. B, 79 (2009) 144304.

(2010年12月21日受理)